トピックス

有機半導体BTQBTの 分子間エネルギーバンド構造E(k)測定

長谷川真史, 上野 信雄^a, 関 一彦^b

分子科学研究所,"千葉大学工学部,"名古屋大学理学部

Intermolecular Energy-band Dispersion of BTQBT Thin Films

Shinji HASEGAWA, Nobuo UENO^{a)}, Kazuhiko SEKI^{b)}

Institute for Molecular Science,

^{e)}Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Chiba University, ^{b)}Department of Chemistry, Faculty of Science, Nagoya University

Angle-resolved ultraviolet photoemission spectra using synchrotron radiation were measured for oriented thin films of Bis (1, 2, 5-thiadiazolo) -p- quinobis (1, 3-dithiole) (BTQBT) on graphite. From the Photon energy dependence of normal emission spectra, the energy-band dispersion of π -bands were observed for the highest (HOMO) and next highest (NHOMO) bands. This is the first observation of intermolecular dispersion in a single-component organic molecular crystal. The results demonstrate that the BTQBT molecules have a strong intermolecular interaction, which should contribute to the low resistivity of BTQBT.

1. はじめに

固体のエネルギーバンド構造E(k)は、物質の 光学的性質や電気的性質を理解する上で重要な知 見を与える。シンクロトロン放射光を用いた角度 分解光電子分光法(SOR-ARUPS)によって、エ ネルギーバンド構造が実験的に決定されるように なったのは、1970年代の終わりごろからである。 以来、金属や無機半導体などについて数多くの実 験が行われ、今日では、SOR-ARUPSは固体のエ ネルギーバンド構造を研究するための代表的な手 法になっている^{1), 2)}。その一方で,有機分子性固体 のエネルギーバンド構造をSOR-ARUPSで求める 実験は,これまでに僅かしか行われていない。そ の理由の1つに,有機試料に特有な実験上の問題 をあげることができる。光電子分光法では表面数 層から放出される光電子を検出する。このため, エネルギーバンド構造測定には,清浄表面を持ち 結晶軸方向の揃った試料を用いねばならない。ま た,測定の前にその結晶軸方向を特定しておく必 要がある。金属や無機半導体の場合には,超高真 空中でのAr⁺イオンエッチング,アニーリング, 加熱クリーニング,あるいはへき開などによっ て,清浄表面をもった単結晶試料の作製法が確立 されている。また,低速電子線回折(LEED)など による結晶軸方向の測定方法も十分に確立されて いる。しかし有機分子性固体の場合には,Ar⁺イ オンや熱,またLEEDのプローブである電子線が 試料表面に損傷を与えてしまう場合が多く,これ らの方法は不適当である。さらに,有機試料では 光電子放出に伴う試料の帯電が起きやすく,これ を防ぐために薄膜試料を用いねばならない場合が 多いといった問題もある。したがって,現状では 有機分子性固体の試料作製に確立された方法はな く,測定しようとする物質ごとに適当な方法を考 えねばならない。

有機半導体,ビス [1,2,5] チアジアゾロ-クキ ノビス (1,3-ジチオール)(BTQBT)(図1)は, 超高真空チャンバー内で、へき開したHOPGグラ ファイト基板に蒸着することで、高度に配向した 薄膜試料(膜厚数+Å)を作製することができる。 エネルギーバンド構造の測定に先だって、試料中 の分子配向を測定し結晶軸方向を調べておく必要 があるが、このような数+Å程度の有機薄膜中の 分子配向を非破壊かつ定量的に調べることは、先 に述べたように通常の実験手法では極めて困難で ある。しかし我々は最近、ARUPSの角度分布の 測定結果をIAC (independent-atomic-center)近 似³⁾の下で解析することで,BTQBTやフタロシア ニンなど,大きな機能性有機分子薄膜中の分子配 向を定量的に見積ることができた^{4).5)}。本稿では, このBTQBT 配向薄膜中の分子配向測定について まず述べ,次にこの薄膜試料における分子間エネ ルギーバンド構造の測定を紹介する⁶⁾。これは,単 一成分から成る有機半導体の分子間エネルギーバ ンド分散が実測された初めての例である。分子間 エネルギーバンド構造の研究は,これまでは主に 理論計算によって行われているが,SOR-ARUPS による測定は,ホールの有効質量や移動度,固体 の内部ポテンシャルなどを実験的に求めることに つながり,その光学的性質や電気的性質をより実 際的に理解するうえで重要である。

2. 分子内バンドと分子間バンド

有機分子性固体のエネルギーバンド構造がSOR-ARUPS によって実測されたのは, 関, 上野らに よる,ポリエチレンのモデル化合物(ヘキサトリ アコンタン CH₃(CH₂)₃₄CH₃の蒸着膜,アラキジン 酸カドミウム [CH₃(CH₂)₁₈COO]₂CdのLB膜など) の分子内バンド分散の測定が初めてである⁷⁻¹⁰⁾。 分子内バンド分散というのは,一つの分子を構成 している繰り返しユニット(この場合はCH₂)がバ



Fig.2 Oriented thin films of organic molecules. (a): molecules are aligned with the molecular axes perpendicular to the substrate. (b) : molecules are aligned with the molecular axes parallel to the substrate. The intramolecular energy-band dispersion (in case (a)) and the intermolecular one (in case (b)) are observed along k_{\perp} .



Fig.1 Structure of bis (1, 2, 5-thiadiazolo) -*p*- quinobis (1,3-dithiole)(BTQBT). It consists of electron-with drawing 1, 2, 5-thiadiazole rings fused to a strongly electron-donating 2, 2'-*p*-quinobis (1, 3-dithiole).

ンド分散の要因となっているものである。これら の実験では図2-(a) に示すように、分子が基板に 対して垂直に配向した薄膜試料を作製して基板に 垂直な波数ベクトル方向(k₄)で測定が行われ, 実際にバンド分散E(k」)が観測されている。分子 内バンド分散では、ユニット間の相互作用は原子 間の強い共有結合によるため、そのバンド幅は数 eV程度にもなる。一方、分子間バンド分散という のは, 固体を構成している分子の周期的な繰り返 しがバンド分散の要因となっているものである。 例えば図2-(b) に示すように、基板に対して分子 面が平行になるように分子がスタックしている場 合, k₁方向に分子間バンド分散が観測されると予 測される。しかし,一般の有機分子性固体では, 分子間相互作用はファンデアワールスの弱い分子 間力によるため、バンド幅はたかだか0.1eV 程度 と小さく",光電子分光装置の分解能などから考 えると実際に分散を測定するのは容易ではない。

最近,我々のBTQBT 配向薄膜の実験[®]や Schmei β erらのジシアノキノンジイミン(DCNQI) のアルカリ金属錯体薄膜の実験¹²⁾などで、分子間 エネルギーバンド分散の測定が報告されるように なってきた。これらの有機伝導体では、電子供与 性のドナー分子と電子受容性のアクセプター分子 間の電荷移動相互作用や、分子を構成している硫 黄,セレン,テルルなどのカルコゲン原子による 分子間相互作用の増大などによって、実際に分散 を測定することが可能な程度のバンド幅を持つ。 BTQBT は、山下らによって合成された単一成分 から成る有機半導体である13)。単一成分から成る 有機半導体とは、テトラチアフルバレン(TTF) の長鎖アルキルチオ誘導体のテトラキス(アルキ ルチオ)テトラチアフルバレン(TTC_n-TTF)や そのテルル Te 置換体(TTeC₁-TTF)などに代表 される物質群で、分子に導入されたカルコゲン原 子による分子間相互作用の増大を利用することに よって,単一成分であるのに低い電気抵抗を示す ようデザインされた化合物である¹⁴⁾。図3に

BTQBT単結晶のX線構造解析の結果を示す¹³。隣 接する分子の硫黄原子間の距離は3.26 Åと硫黄の ファンデアワールス半径の2倍の3.70 Åよりかな り短く,BTQBT分子は2次元のシート構造をとっ ている。さらに,この分子シートは,分子カラム を形成するように3.45 Åの距離でスタックしてい る。この距離は,単一成分では絶縁体であるアン トラセンの面間距離3.77 Åなどに比べてかなり短 い。これらのことはBTQBT分子間の強い相互作 用を示しており,実際,BTQBTは2.7×10⁵Ω cm (分子カラム方向)の低い電気抵抗を示す¹⁵⁾。

3. 実験

実験は分子科学研究所・極端紫外光実験施設 (UVSOR)のビームラインBL8B2¹⁶⁾で行った。こ のラインに設置されている平面回折格子分光器の 波長範囲はhv = 2-100eVと広く,エネルギーバ ンド分散の測定が十分に行える。角度分解固体光 電子分光器は,主測定室,試料作製室,試料移送 システムから構成されており,試料作製室で作製 された試料を超高真空中で移送して,角度分解光 電子スペクトルを測定できるようになっている。

BTQBT 配向薄膜(膜厚≃30Å)は~10⁻¹⁰Torr



Fig.3 BTQBT molecules in single crystal. The network sheet is formed by short S •••S contact of 3.26Å. The spacing between network sheets is 3.45Å, and molecule is inclined by $\simeq 5^{\circ}$ in the sheet. In the present experiment, the energy-band dispersion was observed along k_⊥.

下でへき開した HOPG 基板に, BTQBT を 0.2 Å /minの速度で蒸着して作製した。蒸着時の真空度 は~10^{-®}Torr, 基板の温度は 25 °C である。図4 に, SORの光入射角 α と光電子放出角 θ の関係を 示す。実験では, 光電子スペクトルの θ 依存性か ら薄膜中の分子配向をまず測定し,次に入射光エ ネルギー(h ν)依存性からエネルギーバンド分散 を測定した。

4. BTQBT 分子の配向性

多くの場合,結晶表面に配列成長した有機分子 薄膜は,電子線回折やX線回折などによって調べ られる。これらの方法に比べてARUPSは,(1) プローブの紫外線による試料表面の損傷が少な い,(2)光電子の平均自由行程が小さいために 薄膜中の平均構造ではなく,表面近傍(約10 Å以 下)の構造を測定できる,(3)分子の配向方向(図 5の β , ϕ_s , ϕ_m)を定量的に評価できる,といっ た特徴を持っている。

ARUPSによる配向評価は、結晶表面に吸着し たCOやN₂など小さな分子について、これまでに 多くの実験が行われている^{17)、18)}。その解析では、 励起された光電子が基板表面の原子や周辺の分子 などによって散乱される効果 (multiple scattering)などを取り入れた理論が用いられてい る¹⁹⁾⁻²¹⁾。この解析方法を、BTQBTやフタロシア ニンなどの大きな有機分子に適用することは困難 である。このため、これまで大きな有機分子の場 合には、始状態の分子軌道を同じ対称性の原子軌 道に単純化して解析が行われたり^{22)、23)}、光学遷移



Fig.4 Experimental parameters in ARUPS measurements.

の選択則からその配向性が定性的に考察されたり していた²⁴⁾⁻²⁷⁾。しかし,分子デバイスの研究など に関連した機能性有機分子薄膜のより精度のある 実験を行う場合,実用的な定量的解析法が必要で ある。

図 6に、BTQBT配向薄膜の光電子スペクトルの θ 依存性を示す⁴⁾。測定は、入射光エネルギーh ν = 40eVのSOR光を用い、 $\alpha = 0$ °の垂直入射条 件で行った。価電子帯の上から2番目のNHOMO (next highest occupied molecular orbital)バ ンドと1番上のHOMO(highest occupied molecular orbital)バンドの光電子放出強度の変 化は顕著であり、例えばNHOMOバンドに着目す ると、 θ が大きくなるのに伴って光電子放出強度 は増加し、 $\theta \simeq 40$ °で最大になり、そして次第に 減少している。IAC (independent-atomic-center) 近似によると、n番目の分子軌道から放出される 光電子波の振幅 A_{tot} は、

$$A_{tot} (\mathbf{R}) = \frac{e^{ikR}}{R} \sum_{a} C_{na} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_{a}} \sum_{l,m} M_{l,a}^{m} y_{l}^{m} (\mathbf{\hat{R}}) \qquad (1)$$

と表される³。ここで、 $\mathbf{R}(=R\hat{\mathbf{R}})$ はディテクター位置、 $\mathbf{k}(=k\hat{\mathbf{R}})$ は光電子の波数ベクトル、 C_{nc} はn番目の分子軌道に属する原子aの原子軌道係数、 \mathbf{R}_{s} はそれぞれの原子位置である。原子因子



Fig.5 Illustration of a BTQBT molecule with inclination angle β to the substrate. ϕ_s is azimuthal angle around the substrate normal n_s. Molecular azimuthal angle ϕ_m is defined in the molecular plane.



Fig.6 The take-off angle (θ) dependences of ARUPS spectra at incidence angle $\alpha = 0^{\circ}$ and $h\nu = 40 \text{ eV}$ in the binding energy region of $0 \sim 3.5 \text{ eV}$. The intensity of the spectra is normalized to the incident photon flux. The NHOMO and HOMO bands are indicated by A and B.

M^{*m}</sup>.<i>a y*^{*n*} (**R**)は,始状態の分子軌道を構成する原子軌 道から連続状態への遷移確率である。つまりIAC 近似では,それぞれの原子から独立に(コヒーレ ントに)放出される光電子波に,分子軌道係数と 原子位置の差による干渉効果を取り入れて光電子 放出強度を計算する。今回の我々の計算方法で は,原子因子の計算の中でホール・ポテンシャル による光電子散乱を取り込んでいるが,周辺の原 子等による散乱は考慮しておらず,かなり単純化 されている。しかし,MoS₂上のフタロシアニン 超薄膜の同様な実験で確かめられているように, 計算値と実測値の対応はかなりよく,大きな機能 性有機分子の分子配向を定量的に解析するのに有 効である^{4).5)}。</sup>

基板上のBTQBT分子の配向は,図5に示したよ うに,分子平面の基板に対する傾き角(β)と方 位角(φ_n),分子の分子平面に対する方位角(φ_m)



Fig.7 The take-off angle (θ) dependences of photoemission intensities for the NHOMO band at α =0°.The experimental results are plotted by the open circles. The calculated angular distribution using β =5° and ϕ_m =90° is shown by the solid line.

のオイラー角で表される。実験で用いたHOPG基 板は単結晶でなく、a-b面(へき開面)内で微小 グレインの集合体構造をとる。このため方位角 ϕ 。 に対しては、360°積分し、傾き角 β と分子の方 位角 ϕ_m をパラメーターにして光電子強度の放出角 θ 依存性を計算した。また、分子軌道係数 C_{na} は MNDO(modified neglect of diatomic overlap)分子軌道法による値を、原子位置 \mathbf{R}_a は X線結晶構造解析の結果を用いた¹³⁾。原子因子 $M_{la}^{n}y_{l}^{n}(\hat{\mathbf{R}})$ を計算するのに必要な各原子における位 相シフトと遷移行列要素は、Goldbergらによる計 算値を用いた²⁸⁾。

図7は、NHOMOバンドの光電子放出強度を放 出角 θ で極座標プロットした結果である⁴。図中、 実測した光電子強度を白丸で示す(図6では示さな かった他の θ での実験値も含んでいる)。実線は、 実測値に最も近い θ 依存性を与える計算値であ り、傾き角 $\beta = 5^{\circ}$ 、方位角 $\phi_m = 90^{\circ}$ であった。 この値は、図3に示した分子シートが薄膜中で基 板に対して平行に並んでいる場合に一致している。 したがって、薄膜中のBTQBT分子は基板に対し てほぼ平行に配向しており、結晶中と同じように 基板に対して垂直方向に分子カラムをつくってい ると予測される。この場合,基板に対して垂直方 向に放出される光電子を測定すれば,分子カラム に基づく分子間エネルギーバンド分散が観測され ることになる。

5. BTQBT 薄膜の分子間エネルギーバンド 分散

基板に対して垂直方向のエネルギーバンド分散 は、垂直放出 (normal emission)の方法で求め る。これは、光電子の観測方向を表面に対して垂 直に固定し ($\theta = 0^{\circ}$)、スペクトルの入射光エネ ルギーhν 依存性からエネルギーバンド分散を測定 するものである。ここで、hvを変化させることは 波数ベクトル kを走査することに対応している。 図8に、BTQBT 配向薄膜の HOMO バンドと NHOMO バンドの入射光エネルギーhv 依存性を 示す⁶⁾。測定は入射角 $\alpha = 50^{\circ}$ で、h $\nu = 12$ eV~ 60eV の範囲で行った。h $\nu = 12$ eVのとき、 HOMOバンドは結合エネルギー約5.4eVのところ



Fig.8 Photon energy dependence of photoelectron spectra at normal emission for BTQBT thin films. The binding energy region is 4~7eV.

にピークを持っている。このピークは入射光エネ ルギーhvを高くしていくと次第に高結合エネル ギー側にシフトし、hv = 20eVのとき最も高い結 合エネルギーに位置する。さらにhvを高くしてい くと、逆方向の低結合エネルギー側にシフトし、 hv = 48eVのときを境にして再び高結合エネル ギー側にシフトする。HOMOバンドのピーク位置 のシフトは全体で約0.4eVである。これに対して NHOMOバンドでは、ピーク位置のシフトは全体 で約0.1eV程度と小さいが、そのピークはHOMO バンドとちょうど逆向きの結合エネルギー側へシ フトしていることがわかる。

垂直放出の方法では,始状態 E_i(k₂)の電子が, 真空準位から内部ポテンシャルV₀だけ下に底を持 つ自由電子的な終状態²³⁾

$$E_{f}(k_{\perp}) = (k_{\perp}\hbar)^{2}/2m^{*} + V_{0}.$$
 (2)

へ垂直遷移で励起されると単純化して,光電子放 出過程を考える。ここで, m^* は固体中の光電子の 有効質量である。図8の入射光エネルギー $h\nu$ 依存 性の実験からは,それぞれの $h\nu$ における終状態 $E_f(k_1)のエネルギーがわかるので,始状態 <math>E_i(k_1)$ のエネルギーは $E_i(k_1) = E_f(k_1) - h\nu$ より計算され る。したがって,内部ポテンシャルV。の値がわか っていれば,(2)式から波数ベクトル k_1 が求めら れる。多くの場合V。の値は,一定始状態(CIS)ス ペクトルにおける光電子の強度変化などから求め られる。本実験の解析では,始状態が(3)式の最 近接分子のみを考慮した強束縛型近似で表される と仮定し,図8の実験結果を最小自乗法で解析し て分散曲線を求めた。

$$\mathbf{E}_{i}(\boldsymbol{k}_{\perp}) = \mathbf{E}_{\mathrm{B}}^{0} - 2t \cos\left(a_{\perp}\boldsymbol{k}_{\perp}\right). \tag{3}$$

ここで, E^aは真空準位から測ったバンド中心のエ ネルギー位置, *t* は BTQBT 分子間のトランスフ ァー積分, *a*₊は基板に対して垂直方向の格子間隔 である。ここでは解析の詳細を述べないが⁶⁰,こ の方法が可能であったのは、広い入射光エネル ギー範囲での測定から、波数ベクトルの広い領域 にわたる実験値が得られたためである。

図9は、最小自乗法の結果得られたHOMOバン ドの分散関係 $E_i(k_i)$ を,拡張ゾーン形式で表した ものである。黒丸は、図8のそれぞれのhvにおけ るHOMOバンドのピーク位置に対応している(そ の他のh v における実験データも含んでいる。)図 **8**では、 $h\nu = 20eV \ge 48eV を境にしてピーク位$ 置のシフト方向が変化したが、それらの波数k_が ブリルアンゾーン端にほぼ対応している。実線 は, (3) 式で表される E_i(k_)のベスト・フィット 曲線であり、黒丸の実験値をよく表している。こ の最小自乗法の解析結果から、(2)式及び(3)式 の V_0 , E_B^0 , t, a_1 の値として, $V_0 = -12.5 \text{eV}$, $E_B^0 = 5.4 \text{eV}, t = 0.092 \text{eV}, a_\perp = 3.4 \text{ Å}, が得られ$ た。この格子間隔の a」の値は図3の分子シート間 隔3.45 Åとよい一致を示している。さらに、これ らの値からホール有効質量はm^{*} ~ 3.1m。と見積も られた。また、移動度の値は broad hand model³⁰⁾ (バンド幅 $W > k_{B}T$) から, $\mu_{h} > 6.5 \text{cm}^{2}$ /Vsecと計算された。この移動度の値は、今枝ら によるBTQBT単結晶の実測値≈4cm²/Vsecにほ ぼ一致している15)。



Fig.9 The experimental dispersion (filled circles) for the HOMO band in the extended zone scheme and the best fit curve (solid line) in the tightbinding model, where the inner potential is V_0 = -12.5eV.

図10は、図9で求めた分子間エネルギーバンド 分散を、還元ゾーン形式で表し直したものである。 また、NHOMOバンドの解析結果も併せて示し た。この図から、(1) HOMO バンドの分子間エ ネルギーバンド構造は、最近接分子のみを考慮し た強束縛型近似でよく表せること, (2) そのバン ド幅の値(4t)は約0.4eVと大きく, BTQBT分 子間の相互作用が普通の有機分子性固体に比べて 強いこと, (3) NHOMOバンドのバンド幅の値は 小さく、その位相はHOMOバンドと逆になってい ること、などを実験的に明らかにすることができ た。以上のように、SOR-ARUPSによるBTQBT 配向薄膜の測定から, 分子間エネルギーバンド構 造や固体の内部ポテンシャル、さらにホールの有 効質量や移動度などを実験的に求めることができ た。単一成分から成る有機半導体 BTQBT は、そ の結晶構造¹³⁾ やバンド計算の結果³¹⁾ から,分子に 導入された硫黄原子による強い分子間相互作用の 存在が予測されていた。本研究で実測したHOMO バンドの構造は、このことを実験的に示したもの である。この分子間の強い相互作用は、キャリ



Fig.10 Intermolecular energy-band dispersion for BTQBT thin films in the reduced zone scheme, where a_{\perp} is 3.4 Å. The solid line represents the best fit curve given in Fig. 9.

ヤー濃度³²⁾ や移動度¹⁵⁾ に深く関わり, BTQBTの 低い電気抵抗の主要な原因の一つであると考えら れる。

6. おわりに

有機伝導体は、絶縁体から半導体、伝導体、超 伝導体など多彩な電気物性を示す。その電気的性 質は HOMO バンドの構造に深く関わっているた め, SOR-ARUPSによる有機伝導体の分子間エネ ルギーバンド構造の測定は重要な研究課題である。 しかし、 今のところ有機分子性固体のバンド構造 がSOR-ARUPSで実測できたのは、その化合物を 超高真空中で蒸着することによって清浄表面をも った配向薄膜が得られる場合(BTQBT, DCNQI のアルカリ金属錯体)か、表面がかなり不活性な 配向薄膜の場合(ポリエチレンのモデル化合物, セクシフェニル³³⁾)に、ほぼ限られている。この ように研究対象となる化合物を制限し、SOR-ARUPSによる有機分子性固体のバンド構造の研 究を妨げているものは、はじめに述べた試料作製 における有機物に特有な問題である。有機伝導体 の中には,超伝導性など興味深い電気的性質を示 すものも数多くあるが、その表面清浄化方法があ まり研究されていないために, SOR-ARUPSによ るバンド構造測定は現時点では難しい³⁴⁾。SOR-ARUPSは固体の実際のバンド構造を直接測定で きる、きわめてユニークな方法である。この方法 による有機分子性固体の電子構造研究は、その表 面清浄化方法や配向薄膜の作製法を確立すること によって今後広く行われよう。

本研究は分子科学研究所の森健彦博士,今枝健 一博士,田中彰治博士,山下敬郎助教授,井口洋 夫教授,及び千葉大学の神谷幸司博士,熊本大学 の藤本斉博士との共同研究として行われた。ま た,実験の様々な局面でサポートしていただいた 分子科学研究所・極端紫外光実験施設(UVSOR) のスタッフの方々にお礼申し上げる。

文献

- F. J. Himpsel and N. V. Smith : Handbook of Synchrotron Radiation Vol. 1b, edited by E. E. Koch (North-Holland, Amsterdam, 1983)905.
- 2) 青野正和:固体物理17,58(1982).
- 3) W. D. Grobman : Phys. Rev. B, 17, 4573 (1978).
- S. Hasegawa, S. Tanaka, Y. Yamashita, H. Inokuchi, H. Fujimoto, K. Kamiya, K. Seki and N. Ueno : Phys. Rev. B, 48, 2596 (1993).
- N. Ueno, K. Suzuki, S. Hasegawa, K. Kamiya, K. Seki and H. Inokuchi : J. Chem. Phys., 99, 7169 (1993).
- S. Hasegawa, T. Mori, K. Imaeda, S. Tanaka, Y. Yamashita, H. Inokuchi, H. Fujimoto, K. Seki and N. Ueno : J. Chem. Phys., in press.
- K. Seki, U. O. Karlsson, R. Engelhardt and E. E. Koch : Chem. Phys. Lett., **103**, 343 (1984).
- K. Seki, N. Ueno, U. O. Karlsson, R. Engelhardt and E. E. Koch : Chem. Phys., **105**, 247 (1986).
- N. Ueno, W. Gaedeke, E. E. Koch, R. Engelhardt, R. Dudde, L. Laxhuber and H. Moehwald : J. Mol. Electronics, 1, 19 (1985).
- N. Ueno, K. Seki, N. Sato, H. Fujimoto, T. Kuramochi,
 K. Sugita and H. Inokuchi : Phys. Rev. B, 41, 1176 (1990).
- M. pope and C. E. Swenberg : Electronic Processes in Organic Crystals (Clarendon, Oxford, 1982).
- D. Schmeißer, W. Jaegermann, Ch. Pettenkofer, H. Wachtel, A. Jimenez-Gonzales, J. U. von Schütz, H. C. Wolf, P. Erk, H. Meixner and S. Hünig : Solid State Commun., 81, 827 (1992).
- Y. Yamashita, S. Tanaka, K. Imaeda and H. Inokuchi : Chem. Lett., 7, 1213 (1991).
- 14) H. Inokuchi, K. Imaeda, T. Enoki, T. Mori, Y. Maruyama, G. Saito, N. Okada, H. Yamochi, K. Seki, Y. Higuchi and N. Yasuoka : Nature, **329**, 39 (1987).
- 15) K. Imaeda, Y. Yamashita, Y. Li, T. Mori, H. Inokuchi and M. Sano : J. Mater. Chem., 2, 115 (1992).
- K. Seki, H. Nakagawa, K. Fukui, E. Ishiguro, R. Kato, T. Mori, K. Sakai and M. Watanabe : Nucl. Instr. and Meth., A246, 264 (1986).
- 17) J. W. Davenport, Phys. Rev. Lett., 36, 945 (1976).
- 18) K. Horn, A. M. Bradshaw and K. Jacobi, surf. Sci., 72, 719 (1978).

126

- 19) A. Liebsch, Phys. Rev. B, 13, 544 (1976).
- 20) K. Kambe and M. Scheffler, Surf. Sci., 89, 262 (1979).
- D. Dill and J. L. Dehmer, J. Chem. Phys., 61, 692 (1974).
- 22) G. L. Nyberg and N. V. Richardson, Surf. Sci., 85, 335 (1979).
- 23) B. J. Bandy, D. R. Lloyd and N. V. Richardson, Surf. Sci., 89, 344 (1979).
- 24) F. P. Netzer, Vacuum, 41, 49 (1990).
- 25) M. G. Ramsey, G. Rosina, F. P. Netzer, H. B. Saalfeld and D. R. Lloyd, Surf. Sci., 218, 317 (1989).
- 26) P. Yannoulis, K. H. Frank and E. E. Koch, Surf. Sci., 241, 325 (1991).
- 27) P. Yannoulis, K. H. Frank and E. E. Koch, Surf. Sci., 243, 58 (1991).

- 28) S. M. Goldberg, C. S. Fadley and S. Kono, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 21, 285 (1981).
- 29) F. J. Himpsel : Appl. Optics, 19, 3964 (1980).
- H. Meier : Organic Semiconductors (Verlag Chemie, Weinheim, 1974) chapter 10.
- 31) T. Mori, et al. (unpublished results).
- 32) H. Fujimoto, K. Kamiya, S. Tanaka, T. Mori, Y. Yamashita, H. Inokuchi and K. Seki, Chem. Phys., 165, 135 (1992).
- 33) 石井久夫, 成岡覚, 関一彦, 長谷川真史: 豊田研 究報告 46, 63 (1993).
- 34) M. Yoshimura, H. Shigekawa, T. Mori, M. Kageshima, H. Kato, Y. Sakisaka, G. Saito and A. Kawazu : Jpn. J. Appl. Phys., **31**, 1341 (1992).

きいわーど

単一成分から成る有機半導体

有機分子性固体は、TTF-TCNQやDCNQIのアルカ リ金属錯体などのように2成分以上から構成されてい るもの(multi-component)と、BTQBTなどのよう に単一成分から成るもの(single-component)に分け られる。前者は、さまざまな有機分子や無機イオンの 組み合わせが研究され、超伝導性などを示すものも合 成されている。後者は、分子に導入された硫黄、セレ ン、テルルなどカルコゲン原子による分子間相互作用 の増大を利用して、伝導性を増すようにデザインされ た化合物群である。分子ファスナーと呼ばれるTTFの 長鎖アルキルチオ誘導体(TTC_n-TTF)などが、その 代表としてあげられる。

原子因子

始状態の原子軌道から連続状態への遷移確率 $\langle \phi E_{kin,k} | \hat{\epsilon} \cdot \mathbf{r} | \phi_{nlm} \rangle_{o}$ 今回の解析では、中心のホール・ ポテンシャルによる散乱を考慮した終状態波動関数を 球関数で展開し、光学遷移の選択則から求められた Goldbergらの計算値(位相シフトと遷移行列要素)を 用いて、光電子放出強度の角度分布を計算した。